

## ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 528.32

## ЕТАЛОННИЙ ГЕОДЕЗИЧНИЙ БАЗИС: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ І НОВА АТЕСТАЦІЯ

**І. Тревого, І. Цюпак**

Національний університет “Львівська політехніка”

**В. Герер**

Вища школа, Нойбрандербург

**Ключові слова:** еталонний геодезичний базис...

### Постановка проблеми

Еталонні геодезичні бази є робочими еталонами для метрологічного контролю геодезичних приладів і передавання їм одиниці довжини [1, 6]. Зважаючи на велику кількість різноманітних модифікацій вимірвальних приладів, які випускають різні фірми, та їх використання впродовж багатьох років, важливим питанням є підтримання єдиної одиниці довжини.

$$\frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = \frac{L \cdot C}{(\Delta x)^2} \cdot \frac{\partial^2 i}{\partial t^2} + \frac{L}{(\Delta x)^2 R} \cdot \frac{\partial i}{\partial t}, \quad (1)$$

де  $R$  –

### Виклад основного матеріалу проблеми

Результати метрологічної атестації за 2003–2009 рр. висвітлено в роботі [4].

### Аналіз останніх досліджень та публікацій, які стосуються вирішення цієї проблеми

Значимо, що...

### Невирішені частини загальної проблеми

Порушення екологічної...

### Постановка завдання проблеми

Проаналізувати запропонований...

### Виклад основного матеріалу проблеми

Авторами свого часу...

Таблиця 1

Різниця довжин інтервалів лінійного базису між значеннями, вимірними електронними тахеометрами і віддалеміром ПЛД-1М, мм

Інтервали	Trimble 5601DR		Leica TCR (2009)
	2006	2007	
	віддалеміра ПЛД-1М (2003)		
1–2	-0,4	0,0	0,4
2–3	0,5	0,1	-0,8

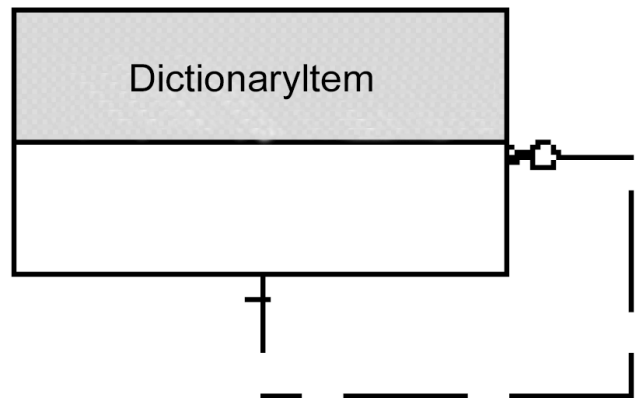


Рис. 1. Деревоподібна структура спеціальних значень

### Висновки

1. Аналіз літературних...

### Література

1. ...
2. ...

**Еталонний геодезичний базис:  
аналіз результатів і нова атестація**  
І. Тревого, І. Цюпак, В. Герер

Проаналізовано метрологічну атестацію...

**Эталонный геодезический базис:  
анализ результатов и новая аттестация**  
И. Тревого, И. Цюпак, В. Герер

Выполнен анализ метрологической аттестации...

**The standard geodesic basis:  
analysis of results and a new certification**  
I. Trevoho, I. Tsyupak, V. Heger

The analysis of the metrological certification...